西はりま天文台近赤外線カメラ NIC 限界等級の再測定

高橋 隼1、 禅野 孝広、石黒 正晃2

1) 兵庫県立大学 自然 · 環境科学研究所 天文科学センター 2) ソウル大学

Re-measured Limiting Magnitudes of the NIC

Jun TAKAHASHI¹, Takahiro ZENNO, Masateru ISHIGURO²

Center for Astronomy, University of Hyogo, Sayo-cho, Hyogo 679-5313, Japan
 Seoul National University, San56-1, Shillim-dong Gwanak-gu, Seoul 151-742, South Korea

E-mail: takahashi@nhao.jp

(Received 2013 December 30)

概要

我々は、西はりま天文台 3 波長同時観測近赤外線カメラ(NIC)に、多回数サンプリングモードを導入し、限界等級を再測定した。1200 秒積分、8 回平均サンプリングモードでの限界等級 (S/N = 10) は、J = 18.9 [mag], H = 19.0 [mag], Ks = 18.0 [mag] であった。

Abstract

We re-measured limiting magnitudes of the Nishiharima Infrared Camera (NIC), after implementation of Fowler sampling modes. The limiting magnitudes (S/N = 10) of J = 18.9 [mag], H = 19.0 [mag] and Ks = 18.0 [mag] were derived from images obtained with a 1200 s integration and eight-time Fowler samplings.

Key words: science instrument – near-infrared – performance – photometry

1. はじめに

西はりま天文台 3 波長同時観測近赤外線カメラ(Nishiharima Infrared Camera: NIC)は、なゆた望遠鏡カ セグレン焦点に取り付けられている観測装置である。近赤外 *J*, *H*, *Ks* バンドの画像を同時に取得できる特徴 がある。NIC の主な仕様・性能は、Ishiguro et al. (2011)にまとめられている。我々は多回数サンプリング (Fowler sampling, Fowler & Gatley, 1990) モード導入に向けた開発試験を続けてきた。これは検出器に対し て非破壊読み出しを複数回行い、その平均値を取ることで、読み出しノイズを低減するものである。サンプリ ング回数 *k* の場合、検出器リセットの後、*k* 回の読み出しを行い、設定露出時間の経過後に、さらに *k* 回の 読み出しを行う¹。露出前後の *k* セットの差分をとり、それらの平均値をカウントとして出力する。2013 年 に 4 回平均 (×4 sampling) および 8 回平均サンプリング (×8 sampling) モードを実用化することができたの で、改めて限界等級の測定を行った。

¹1回の読み出しに2秒かかるため、サンプリング回数 k の場合の最低露出時間は 2k 秒である。

J. Takahashi et al.

2. 観測、測光

測定に用いたのは、2013 年 3 月 5 日(外気温 5.8°C)に観測した散開星団 NGC 2420 の画像である。8回平 均サンプリングモード、1 回サンプリング(×1 sampling) モード² に対して、それぞれ 1 ショット 120 秒露出 の 10 点ディザリング観測(半径:10″)を行った。Ishiguro et al. (2011) と同様に、ダーク差し引き、フラット 補正、バッドピクセル・ホットピクセル・ダークピクセル除去、セルフスカイ差し引き、縦パターン除去、足 し合わせの画像処理を行った。Fig. 1 は測光に用いた画像である (*J*バンド)。星像の FWHM (full-width at half-maximum) は、約 1.1″(7 pixels)であった。測光半径 1.5 FWHM として、IRAF の apphot.phot タス クを用いて測光を行った。視野内の 2MASS (Skrutskie et al., 2006) 点源との相対測光により等級を求めた。



Fig. 1. Processed J images for photometry. (Left) $\times 8$ sampling mode. (Right) $\times 1$ sampling mode.

² ここで言う「1 回サンプリング」とは、「1 回の correlated double sampling」という意味であり、実際には露出前後に 1 回ずつ、 計 2 回の読み出しを行っている。

3. 限界等級

Figs. 2-4 は、得られた S/N (signal-to-noise ratio) を等級に対してプロットしたものである。ここで、S/N は $S/N = 1.086/\sigma_m$ (σ_m : 測光等級誤差) から得た。 σ_m は IRAF の apphot.phot タスクで求めたものである (MERR)。(縦軸を対数スケールとした) 図上でプロットを直線フィットし、フィット関数で S/N = 10 となる 等級を限界等級とした。Table 1 に結果をまとめる。

1回サンプリングに比べて8回平均サンプリングの限界等級は、Jバンドで0.5 mag、Hバンドで0.3 mag 深くなっている。一方、Ksバンドではほとんど変化していない。この結果について、限界等級を制約するノイズを分析して説明を試みる。Table 2 は、スカイノイズと読み出しノイズを算出し、それらによる総ノイズの変化に基づいて、1回サンプリングと8回平均サンプリングでの限界等級の差を見積もったものである。 J,Hバンドでは、ほぼ見積り通りに8回平均サンプリングでの限界等級が深くなっていることがわかる。Ksでは、ノイズからの見積りでは0.2 mag ほど深くなるという結果が得られ、実測値と食い違う。この原因は不明であるが、読み出しノイズの不定性(読み出しごとのランダムな変化や Ishiguro et al. 2011 での測定時点からの経年的変化)が影響している可能性がある。



Fig. 2. Magnitudes vs. S/N diagram for J band.

J. Takahashi et al.



Fig. 3. Magnitudes vs. $S\!/\!N$ diagram for H band.



Fig. 4. Magnitudes vs. S/N diagram for Ks band.

Table 1. Limiting magnitudes.

Sampling	$J [\mathrm{mag}]$	H [mag]	$Ks \;[mag]$
$\times 1$	18.4	18.7	18.1
$\times 8$	18.9	19.0	18.0

Table 2. Estimates of differences in limiting magnitudes

Band	Sampling	Sky[ADU]	$N_{sky}[e^-]$	$N_{read}[e^-]$	$N_{total}[e^-]$	$R_{8/1}$	Est. Δm
J	$\times 1$	205	137	158	209	-	-
	$\times 8$	210	139	35	143	0.68	0.41
Н	×1	2330	478	237	533	-	-
	$\times 8$	2085	452	35	453	0.85	0.18
Ks	$\times 1$	1430	367	262	451	-	-
	$\times 8$	1430	367	32	368	0.82	0.22

 N_{sky}, N_{read} , and N_{total} stand for sky background noise, effective readout noise, and total noise, respectively. Sky counts in ADU are converted to electron unit using an effective conversion factor (C.F), which is calculated as $n \times (single \ C.F)$, where n represents the dithered (i.e., combined) number (n = 10 for our data). Then, $N_{sky}[e^-] = \sqrt{\text{Sky}[e^-]}$ is used. Effective readout noise is obtained by $N_{read} = \sqrt{n} \times (single \ readout \ noise)$, where values of single readout noise were derived by Ishiguro et al. (2011) (see Table 3 in this paper). $N_{total}^2 = N_{sky}^2 + N_{read}^2$ is assumed. $R_{8/1}$ is the ratio of N_{total} for $\times 8$ sampling to that for $\times 1$ sampling. Δm , which is defined as (Lim. mag. for $\times 8 \ sample$) – (Lim. mag. for $\times 1 \ sample$), is estimated by $-2.5 \times \log R_{8/1}$.

J. Takahashi et al.

4. まとめ

8 回平均サンプリングモードの導入後、同モードでの限界等級を求めた。S/N = 10となる限界等級は、J = 18.9 [mag], H = 19.0 [mag], Ks = 18.0 [mag] と求まった。表 3 は、 更新された NIC 性能一覧である。

	Unit	J	H	Ks	Remarks
Wavelength center	$\mu { m m}$	1.25	1.63	2.15	
Wavelength width	$\mu { m m}$	0.16	0.30	0.31	
Conversion factor	e^{-}/ADU	9.2 ± 0.2	9.8 ± 0.2	9.4 ± 0.2	
Readout noise	e^{-}	50 ± 4	75 ± 4	83 ± 5	$\times 1$ sampling mode
		${\sim}17$	${\sim} {f 23}$	${\sim} {f 27}$	$\times 4$ sampling mode
		${\sim}11$	${\sim}11$	${\sim}10$	$\times 8$ sampling mode
Linearity limit	ADU	$\sim 8,000$	$\sim 8,000$	$\sim 8,000$	Incl. counts before the first read.
Field of view	arcmin^2	2.73×2.73	2.73×2.73	$2.73{\times}2.73$	
Pixel scale	$\operatorname{arcsec/pix}$	0.16	0.16	0.16	
Limiting magnitude	mag	18.9	19.0	18.0	$S/N = 10, 120 \text{ s} \times 10 \text{ dither}$
					$\times 8$ sampling mode
Photometry precision	mag	0.014	0.005	0.011	10 s \times 10 dither \times 26 set
					$\times 1$ sampling mode
					Ref: $J=10.8$, $H=10.2$, $Ks=9.9$
					Object: $J=11.2, H=10.7, Ks=10.6$

Table 3.	Performance	of NIC	in 2013
----------	-------------	--------	---------

Bold texts are information added or renewed since Ishiguro et al. (2011).

This publication makes use of data products from the Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by the National Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation.

参考文献

Fowler, A. M., & Gatley, I. 1990, ApJL, 353, L33

Ishiguro M., Takahashi J., Zenno T., Tokimasa N., & Kuroda T. 2011, Annu. Rep. Nishi-Harima Astron. Obs., 21, 13

Skrutskie, M. F., et al. 2006, AJ, 131, 1163